



レーザー顕微鏡による表面性状計測技術

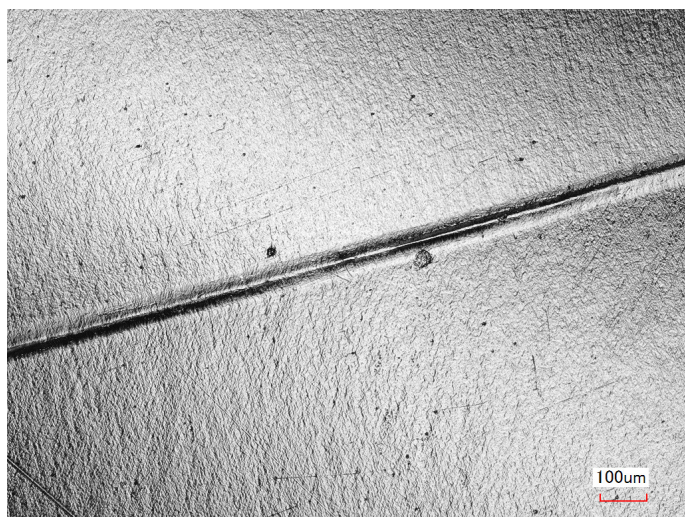
電子線の影響を受けやすい樹脂や透明素材にも対応した表面性状計測・観察をいたします。

概要

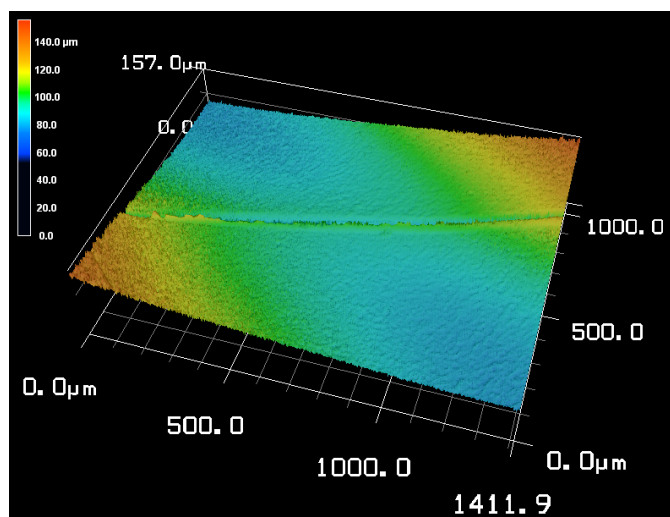
- 表面に凹凸のある試料を観察する場合、光学式顕微鏡では被写界深度が浅く観察が困難なため、一般的には焦点深度の深いSEMを用いますが、試料が電子線の影響を受ける上、煩雑な前処理等を要し観察までに時間がかかります。しかし、レーザー顕微鏡では、電子線の影響は無く、FE-SEMと同様な被写界深度を有し、前処理が不要なため、短時間で鮮明な観察ができます。

表面性状不良が発生したフィルム表面形状計測結果例

- 透明なレプリカフィルムのサンプルでも前処理不要で観察可能です。レプリカフィルムの測定結果から表面状態の3次元・カラースケール表示をすることでより分かりやすい結果をご提供できます。



透明フィルム表面の観察画像



透明フィルムの3次元・カラースケール

形状測定レーザマイクロスコープ VK-X100

- 透明素材のほか樹脂材料や金属製品にも対応可能です。
- 表面形状測定その他計測した高さ情報から断面プロファイルや線粗さの結果もご提供いたします。



形状測定レーザマイクロスコープ VK-X100



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2023 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。